

DIN 50451-7:2018-04 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 7: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner Salzsäure mittels ICP-MS

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Einheiten	5
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens	5
5.1 Allgemeines.....	5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdünnung	5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen.....	5
6 Reagenzien	5
7 Geräte und Reinigung	6
7.1 Geräte.....	6
7.2 Reinigungsverfahren für Gefäße und Pipettenspitzen	6
8 Probenahme und Probenvorbereitung.....	6
8.1 Probenahme.....	6
8.2 Vorbereitung der direkten Messung.....	6
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen.....	6
9 Herstellen der Nullwertlösungen und Blindwertprobe.....	7
10 Durchführung	7
10.1 Messung.....	7
10.2 Kalibrierung.....	7
11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse.....	7
12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse.....	7
13 Prüfbericht	9
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche.....	10
Literaturhinweise	14